

計画停電予定継続期間 利用可能機器一覧

設備番号	設備名称	機種名等	装置使用	適用	使用開始までにかかる時間の目安
1	核磁気共鳴装置(AV300)	NMR300MHz(AVANCE300)	△	復電後再起動	再起動後 1時間
2	核磁気共鳴装置(AV500)	NMR500MHz(AVANCE500)	△	復電後再起動	再起動後 1時間
3	核磁気共鳴装置(AV500T)	NMR500MHz(AVANCE500T)	△	復電後再起動	再起動後 1時間
4	高感度核磁気共鳴装置(DRX400)	NMR400MHz(DRX400+Cryo)	×	震災により破損	
5	高分解能磁場型質量分析装置	Secter-MS(JMS700AM)	×	計画停電予定継続期間中停止	
6	飛行時間型質量分析装置	MALDI-TOF/MS(Autoflex)	△	復電後再起動	再起動後 1日
7	ナノフローLC質量分析装置	LC/ESI-TOF/MS(NanoelD)	△	復電後再起動	再起動後 1日
8	液体クロマトグラフ質量分析装置	LC/ESI-TOF/MS(Mariner)	×	計画停電予定継続期間中停止	
9	四重極GC質量分析装置	GC/Q-MS(JEOLAutoMS)	×	計画停電予定継続期間中停止	
10	顕微フーリエ変換赤外分光光度計	MicroFT-IR(Hyperion)	○	使用時起動	起動後 1時間
11	赤外ノラマン分光光度計	FT-Raman(SYSTEM2000R)	△	復電後再起動	再起動後 1時間
12	赤外分光光度計	FT-IR(SYSTEM2000)	△	復電後再起動	再起動後 1時間
13	誘導結合プラズマ発光分析装置	ICP(OPTIMA5300DV)	△	復電後再起動	再起動後 1日
14	パルス電子常磁性共鳴装置	PulseEPR(ELEXSYS580)	○	使用時起動	
15	電子常磁性共鳴装置	EPR(BRUKEREMX6/1)	○	使用時起動	
16	蛍光X線分析装置	XRF(PHILIPSPW2400)	△	復電後再起動	再起動後 4時間
17	粉末X線回折装置(水平型)	XRD(RIGAKUUltima III)	△	復電後ブレーカーのみ再起動	
18	卓上型粉末X線回折装置(水平型)	XRD(BRUKERD2PHASER)	○	使用時起動	
19	高出力粉末X線回折装置(縦型)	XRD(MACSMXP18VA)	×	計画停電予定継続期間中停止	
20	高出力粉末X線回折装置(横型)	XRD(MACSMXP18A)	×	計画停電予定継続期間中停止	
21	高輝度CCD型単結晶構造解析装置	SCXRD(SMARTAPEX II)	△	復電後再起動	再起動後 3時間
22	CCD型単結晶構造解析装置	SCXRD(SMARTAPEX)	△	復電後再起動	再起動後 2時間
23	4軸型単結晶構造解析装置(3K)	SCXRD(MACSMXC3KHF)	○	使用時起動	
24	走査型電子顕微鏡	SEM(HITACHIS-2400)	○	使用時起動	EDXは起動後 1時間
25	低温低真空走査型電子顕微鏡	LV-SEM(HITACHIS-3400N)	○	使用時起動	EDXは起動後 1時間
26	高分解能走査型電子顕微鏡	FE-SEM(HITACHIS-4100)	△	復電後再起動	再起動後 4時間
27	超高分解能走査型電子顕微鏡	FE-SEM(HITACHIS-4800)	△	復電後再起動	再起動後 1時間
28	透過型電子顕微鏡(120kV)	TEM(HITACHIH-7500)	○	使用時起動	
29	透過型電子顕微鏡(200kV)	TEM(FEITecnaiG2)	×	計画停電予定継続期間中停止	
30	走査型プローブ顕微鏡	SPM(VEECONanoScope III)	○	使用時起動	
31	共焦点レーザー顕微鏡	CLSM(OLYMPUSFV1000-D)	○	使用時起動	
32	複合表面分析装置	ESCA/AES(ULVAC558UP)	△	復電後再起動	再起動後 1日
33	複合熱分析装置	DSC,TG/DTA-FTIR,TMA	○	使用時起動	FT-IRは起動後 1時間
34	超音波顕微鏡	SAM(HITACHIHSAM220)	○	使用時起動	
35	微小材料試験機	Tytron250	○	使用時起動	
36	モアレ干渉計	PEMI-II	○	使用時起動	

凡例

○	計画停電実施時以外は、原則平時通り使用可
△	復電後、センタースタッフが再起動し、目安時間経過後は原則使用可
×	計画停電予定期間中は、原則使用中止